

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/710,175	KANG ET AL.
Examiner	Art Unit
Linh M. Nguyen	2816

SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
327	270	04/04/06	CMN		
(1	271	ţ	q .		
(1	272	4	. 4		
4	276	Ŋ	4		
Ý	277	` "	4		
ų	278	ζ,	6		
333	138	. q	4		
333 7/6	138	6	(ı		

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
		·		
	1		!	

	DATE	EXMF
·		
	!	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>
•		